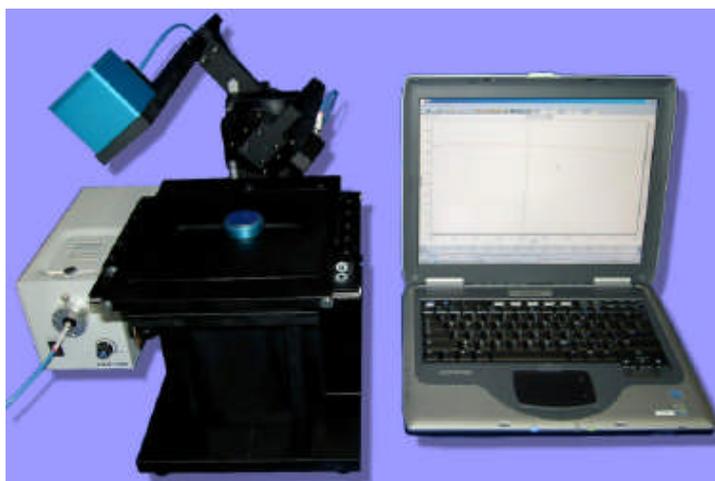


反射、透過、色、マルチ測定 MFS630



特徴

波長範囲：190-1700nmまで任意
 透過・反射率、吸光、色測定など1台で可能
 屈折率 n ・減衰係数 k 、BSDF、膜厚、ヘイズ(オプション)
 ご用途・希望に合わせて自由自在の仕様

構成

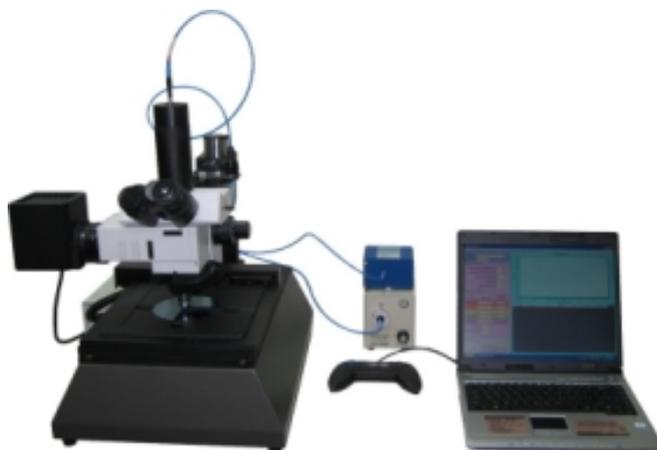
検出器、光源(190~1700nm)、集光系、
 ノート PC(ソフト)、各種ステージ

MFS630 は、透過率、反射率、吸光度、色(xyz, XYZ, L*a*b*)、屈折率 n /減衰係数 k 、膜厚、ヘイズなどすべて測定できる画期的なシステムです。検出器、光源、ステージ、ファイバ、集光系、パソコン、ソフトウェア一体型で、面倒な作業・設定は一切必要ありません。お客様のサンプル・ワークに応じて、ご希望の用途・仕様にて、一台一台製作いたします。フィルタ、ミラー、レンズ、フィルム、ガラス、ポリマー、金属など、光学特性の測定・評価など広範にお使い頂けます。1台でエリプソ、膜厚、透過、反射などマルチ測定可能、省カスペースで、安価に測定できるようになります。

波長範囲	380-950nm (標準)	190-800nm (紫外オプション)	800-1700nm (近赤外オプション)
検出器	2048 素子 CCD 検出器など		256 素子 InGaAs 検出器
スポットサイズ	5mm (径)、0.2mm まで可能		
測定時間	1 秒		
再現性	1%		
分解能	~2nm		
ソフトウェア	透過、反射、色測定(オプション:膜厚、屈折率 n ・減衰係数 k)		
ステージ	10cm x 10cm (40cm x 40cm) 手動 XY ステージ、稼動アーム 顕微マイクロステージ(CCD カメラ付属)、自動 XY ステージなど		
光源	タングステン: 380~1700nm (標準) タングステン・重水素ミックス: 190~950nm 高出力キセノン: 250~1050nm		
表示	付属ノートパソコン 16ビット、USB2.0		
価格	¥3,000,000~ (仕様に依りて価格は変わります)		



40x40cm 手動ステージ



顕微マイクロスポット 反射・透過・膜厚

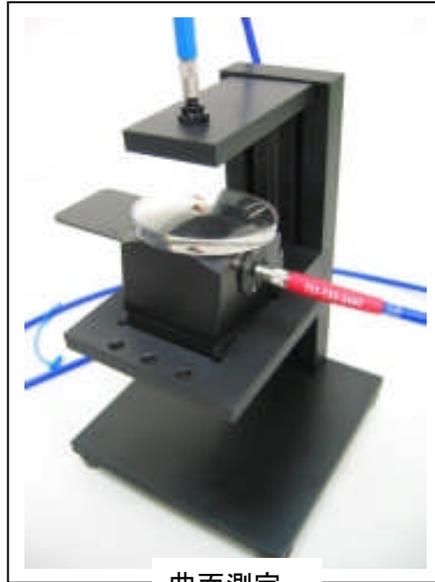
お客様の用途・サンプルに応じて、自由な測定構成

構成や検出器・光源・ステージ(自動・手動)・光学系を自由に組み合わせて、ご希望の用途・測定に対応できます。

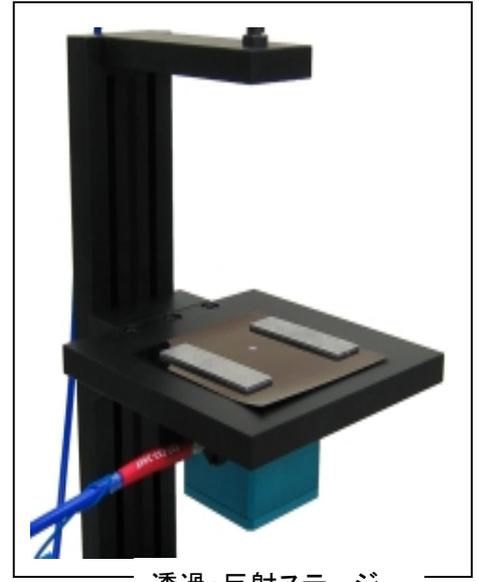
あらゆる特注製作が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。1台1台お作りしております。



透過専用ステージ



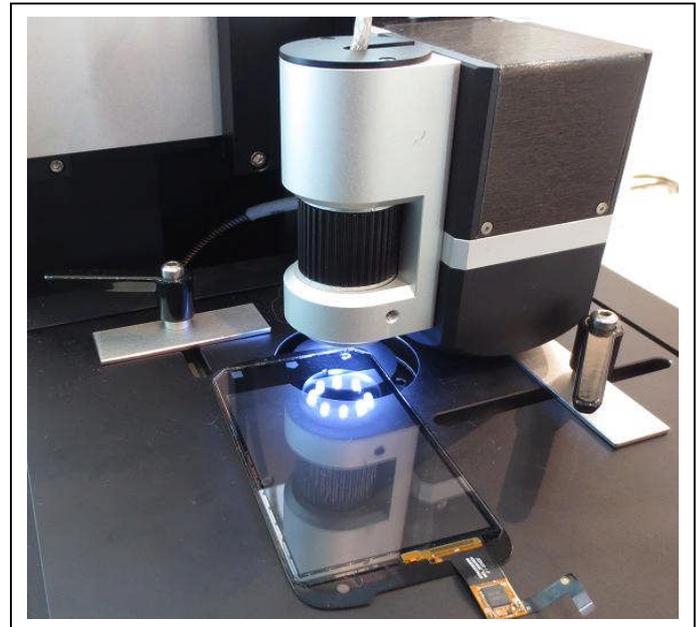
曲面測定



透過・反射ステージ



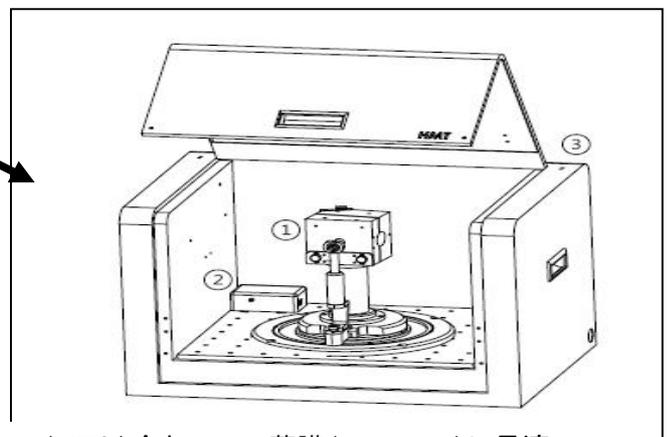
稼動アームで入射・受光角度を簡単調整



顕微スポットで携帯赤外窓を透過測定



構成(右図)
積分球、検出器、外箱



ヘイズ測定(透過・反射): パソコン(ソフト)含む、TCO 薄膜(FTO、ITO)に最適



有限会社 たきぶん

製品のお問い合わせは

TEL: 03-6411-5320 FAX: 03-6411-5319

Email: sales@takibun.jp